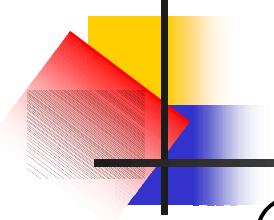


チタン中の水素化物の観察



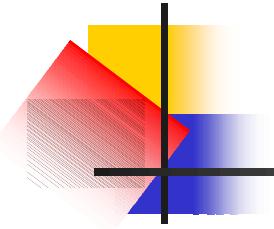
X線屈折コントラスト法によるチタン水素化物の可視化と拡散研究への応用

島根大学総合理工学部 水野 薫



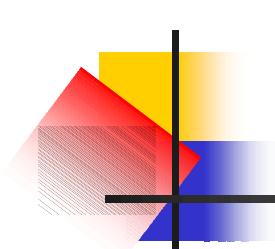
内 容

- ① はじめに
- ② 伝播による方法
(Refraction-enhanced imaging法)
チタンへの応用と問題点
- ③ アナライザーによる方法
(Diffraction-enhanced imaging法)
水素ガス中で焼鈍したチタン
電解チャージしたチタン(断面観察)
水素の拡散係数
- ④ まとめ



チタンについて

- 新しい金属 未知の性質？
- 高完全度単結晶 歪・焼鈍法
(固相のまま単結晶化)
- 高温でも強度が低下しない 構造材料
- 多種多様な合金 機能性材料
 - e.g. 水素吸蔵合金
間接的に水素, 水素化物を検出



目的

水素化物の直接観察

X線吸収写真……不可能

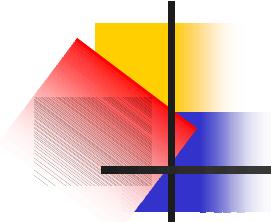
電子顕微鏡……特殊な場合

X線屈折コントラスト法による可視化

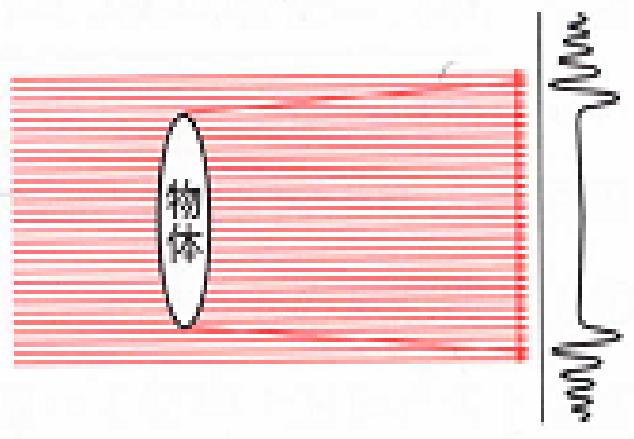
$$n_{\text{Ti}} = 1 - 9.68 \times 10^{-7} \text{ (30keV X線)}$$

$$n_{\text{Ti-H}} = 1 - 1.01 \times 10^{-6}$$

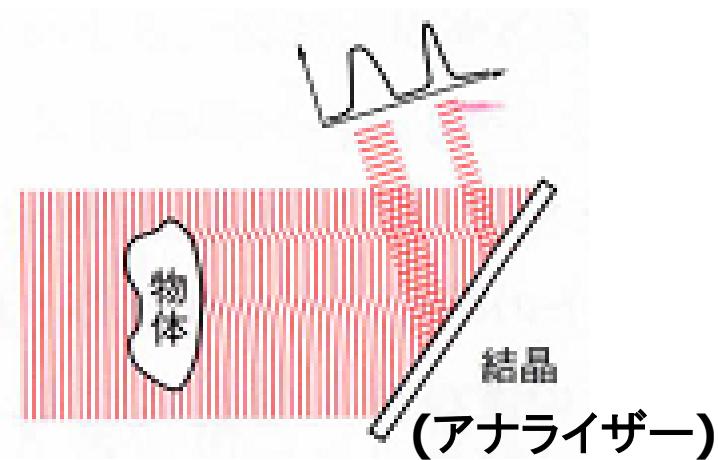
X線屈折コントラスト法 (位相のズレの検出法)

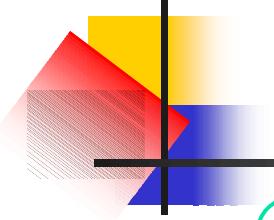


伝播による方法
(**Refraction-enhanced imaging**, REI法)



アナライザーによる方法
(**Diffraction-enhanced imaging**, DEI法)





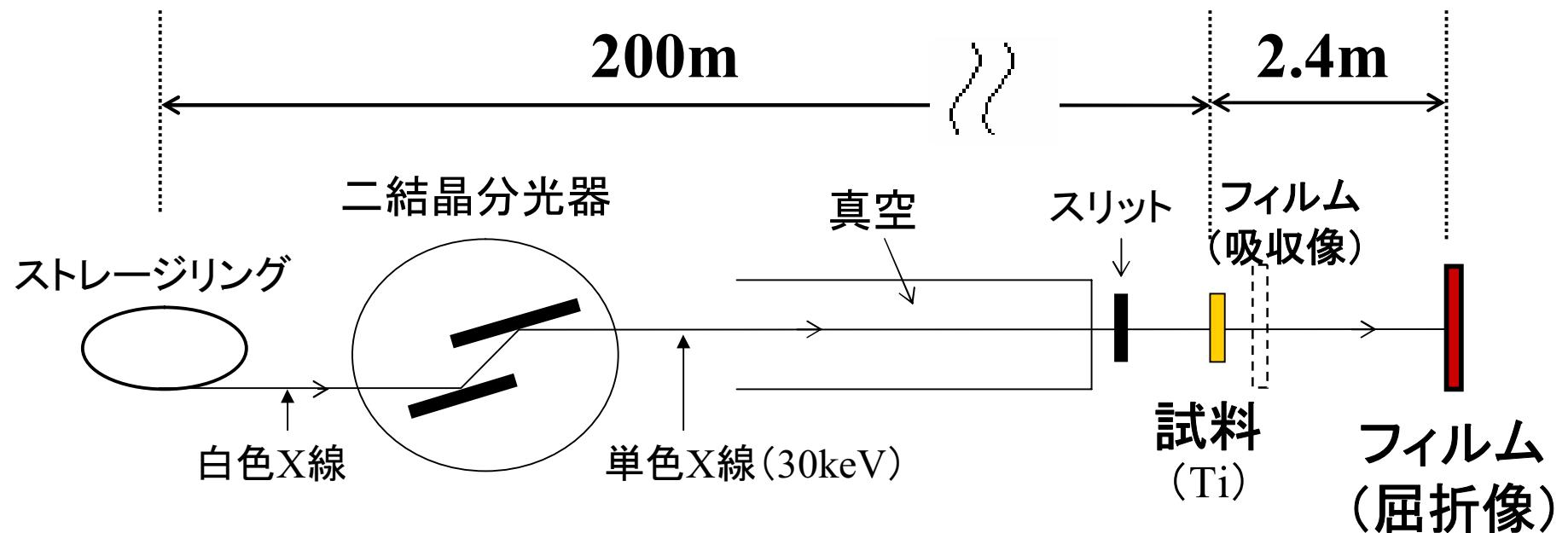
内 容

- ① はじめに
- ② 伝播による方法
(Refraction-enhanced imaging法)
チタンへの応用と問題点
- ③ アナライザーによる方法
(Diffraction-enhanced imaging法)
水素ガス中で焼鈍したチタン
電解チャージしたチタン(断面観察)
水素の拡散係数
- ④ まとめ

伝播による方法でのチタン水素化物の観察

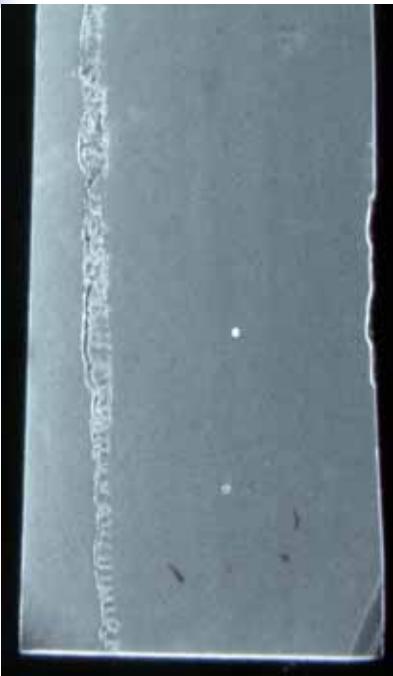
ビームラインの装置配置図(*REI法*)

SPring-8 BL20B2 (平行度 $\approx 3.9 \times 10^{-7}$ rad)

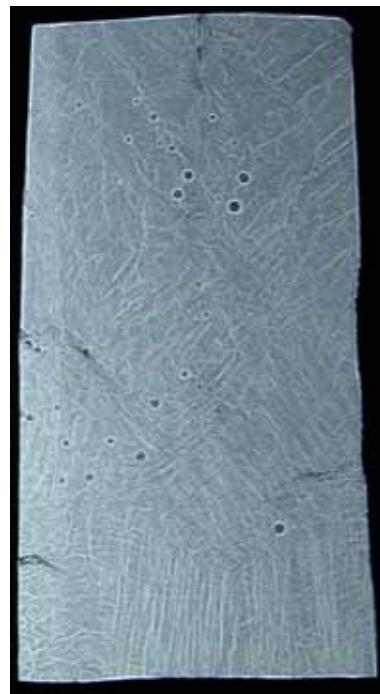


実験結果 (REI法)

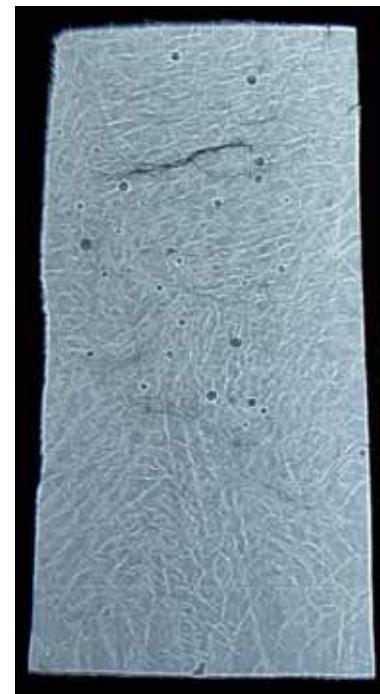
チタン中の水素化物の屈折イメージ



真空焼鈍



水素焼鈍
(500°C 20分)

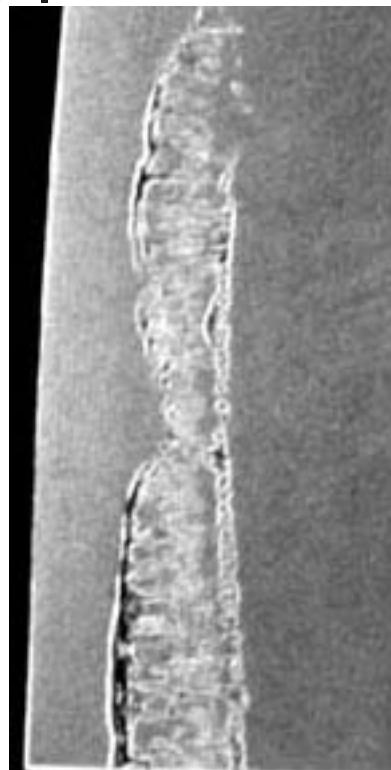
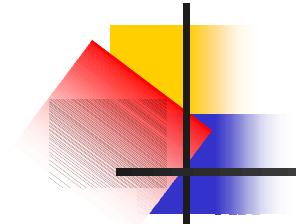


水素焼鈍
(500°C 60分)

1 mm



伝播による方法(REI)の結果 (屈折像と吸収像)



屈折像

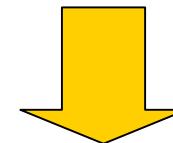
1mm



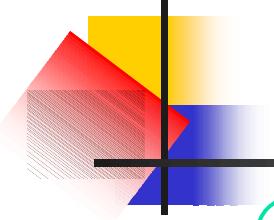
吸収像

屈折像と吸収像の区別

金属系の試料では難
しい可能性あり



アナライザーによる
方法(DEI法)



内 容

① はじめに

② 伝播による方法

(Refraction-enhanced imaging法)

チタンへの応用と問題点

③ アナライザーによる方法

(Diffraction-enhanced imaging法)

水素ガス中で焼鈍したチタン

電解チャージしたチタン(断面観察)

水素の拡散係数

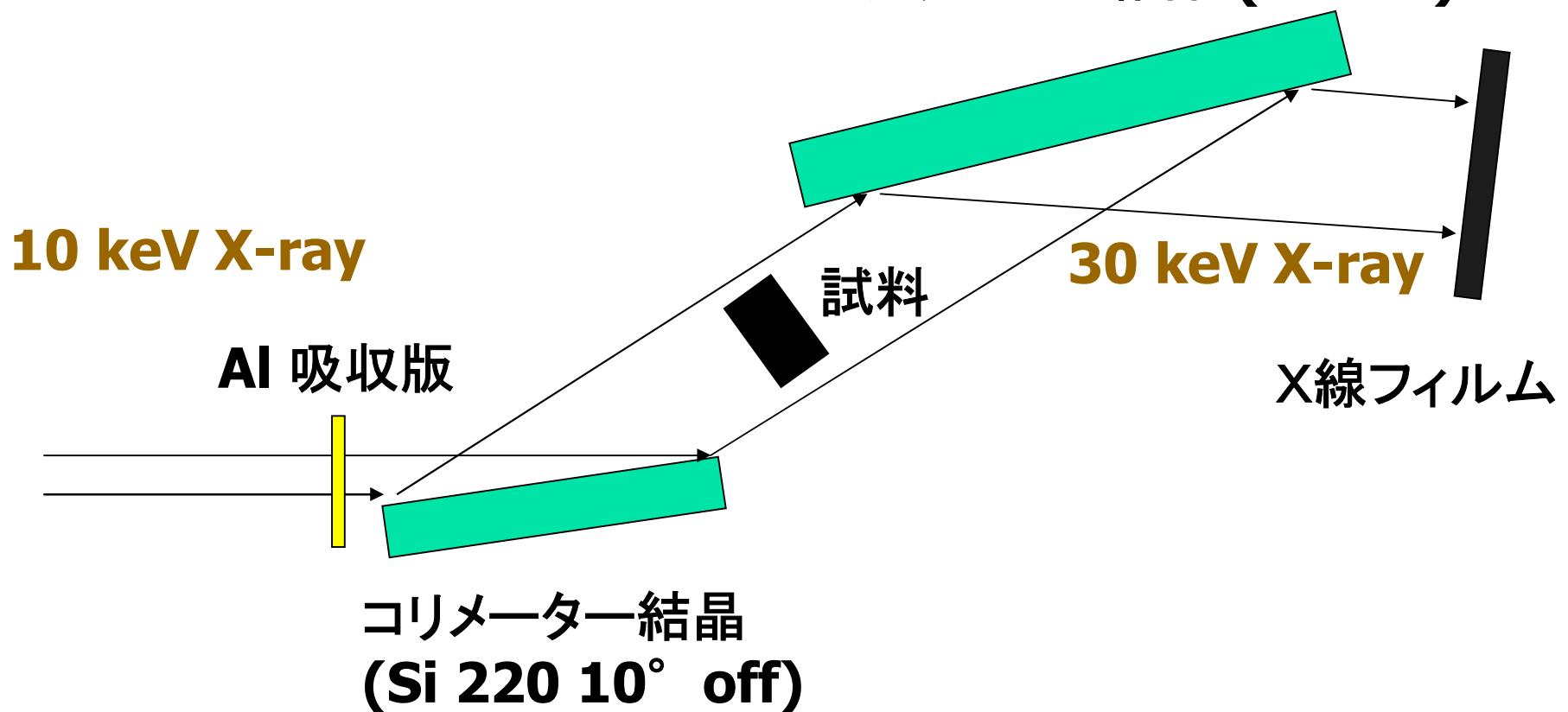
④ まとめ

実験方法

アナライザによる方法(DEI法)

KEK-PF BL-14B

アナライザ結晶 (Si 220)



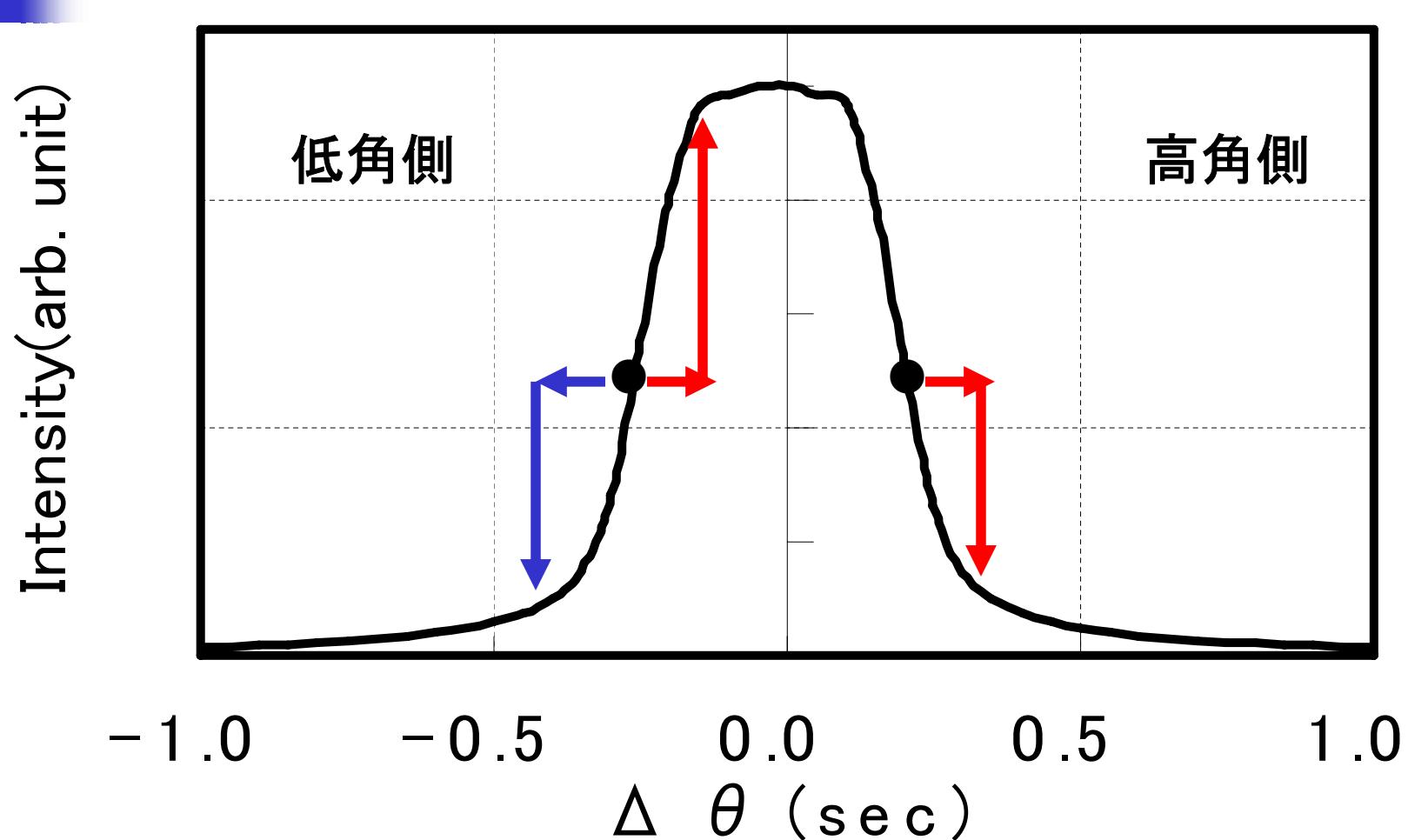
実験装置 高エネルギー加速器研究機構

KEK-PF BL-14B

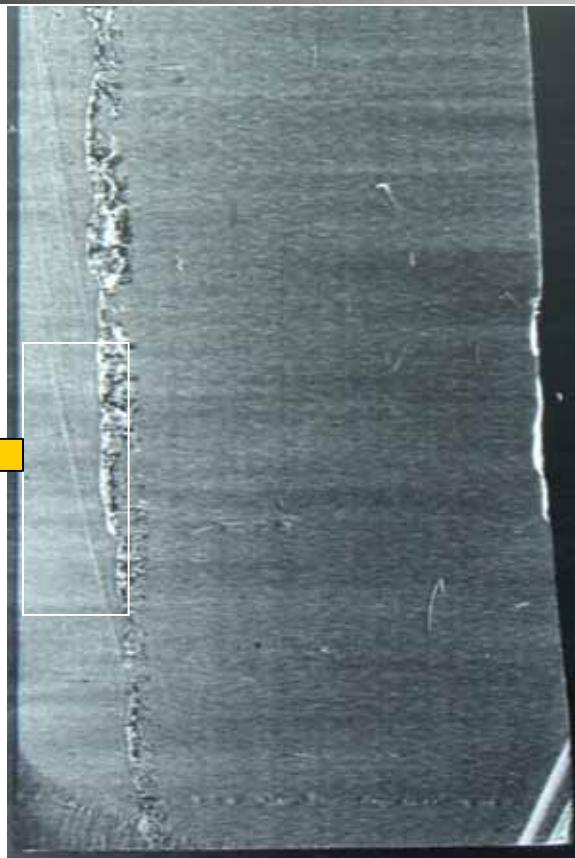


実験結果

ロッキングカーブ(コントラストの反転)

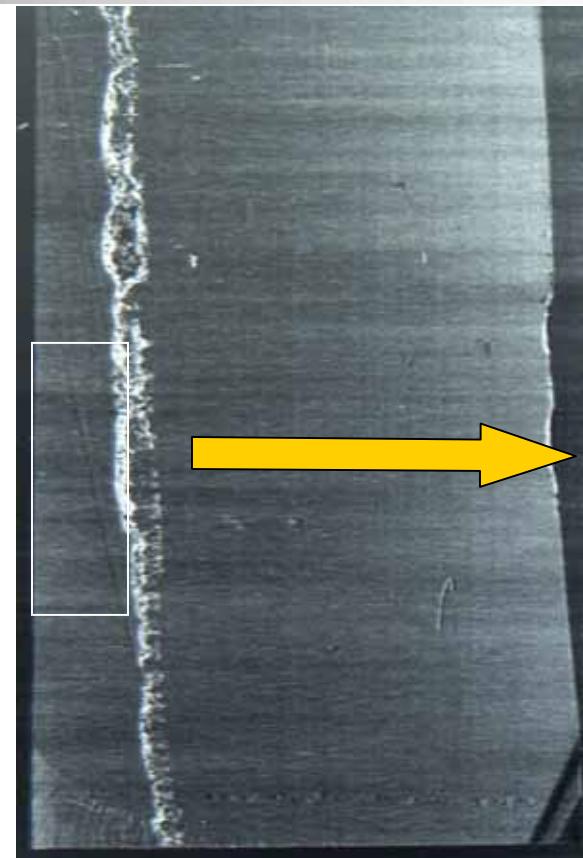


実験結果(水素化物なし) 屈折コントラストの確認



底角側

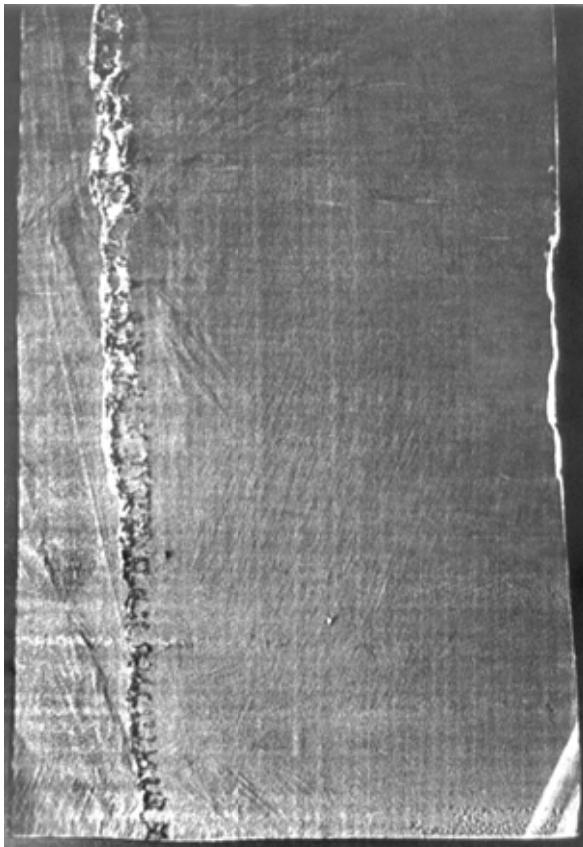
1 mm



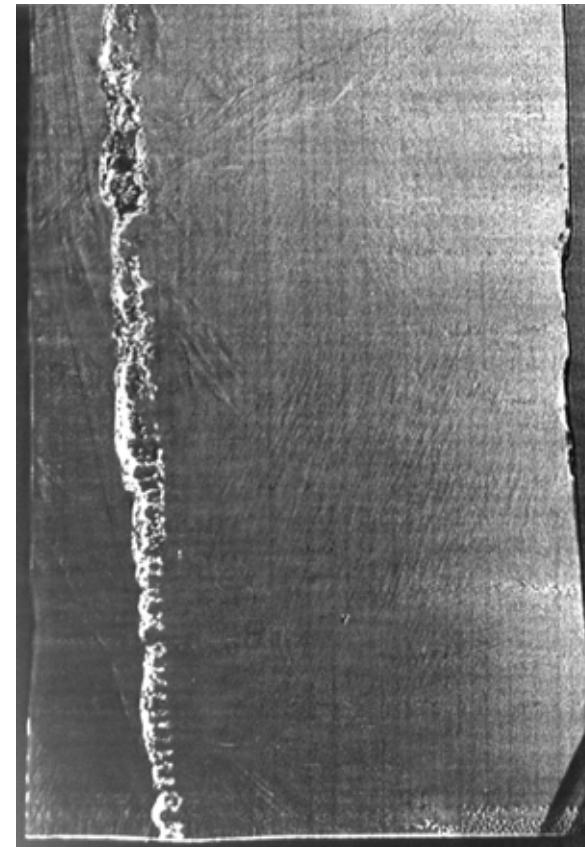
高角側



実験結果(水素化物あり) 回折ピークの低角側と高角側



低角側

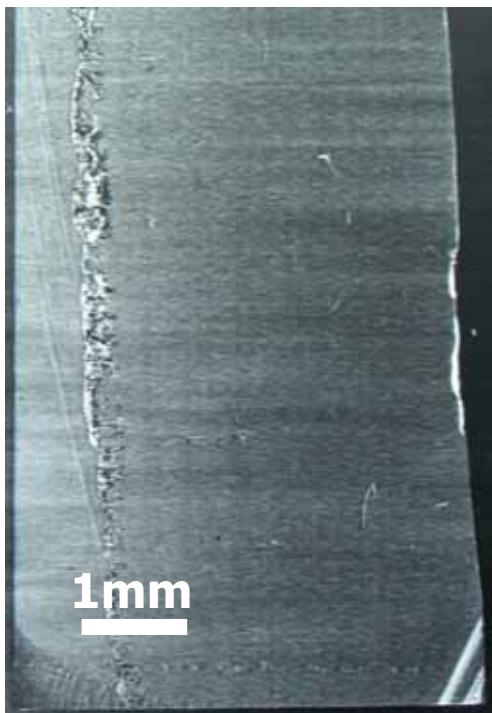


高角側

1 mm

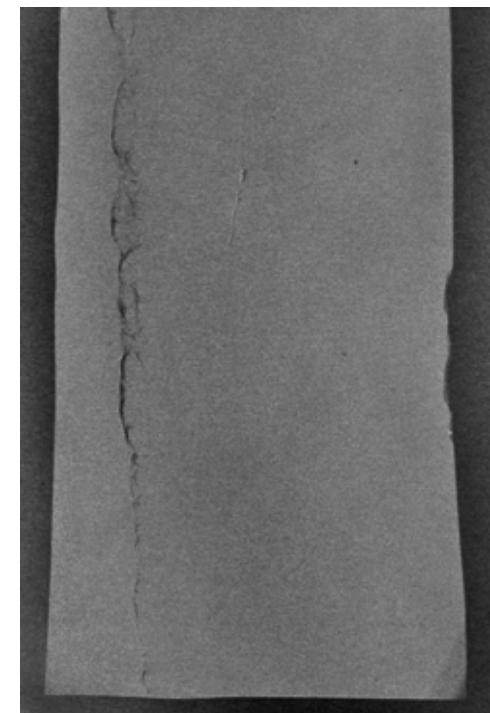
実験結果 水素焼鈍前後の試料(低角側)

屈折コントラスト写真

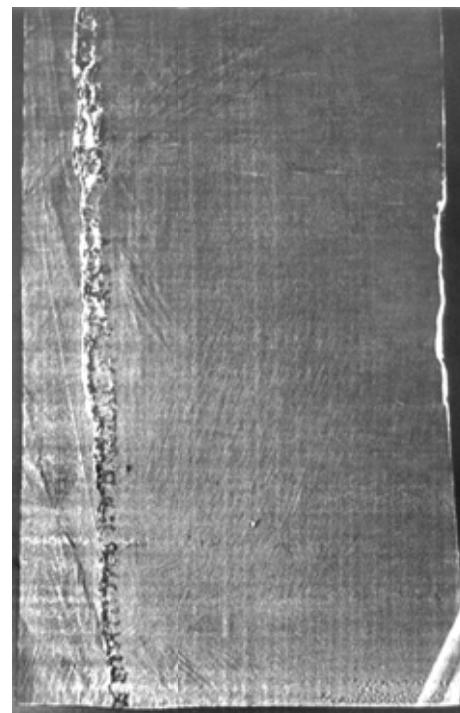


水素焼鈍前

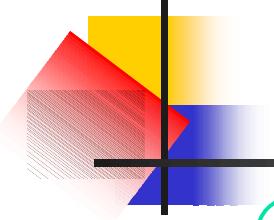
吸収コントラスト写真



水素焼鈍後



水素焼鈍後



内 容

① はじめに

② 伝播による方法

(Refraction-enhanced imaging法)

チタンへの応用と問題点

③ アナライザーによる方法

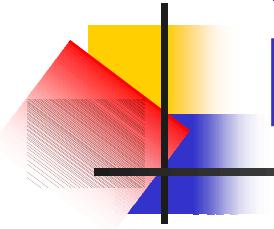
(Diffraction-enhanced imaging法)

水素ガス中で焼鈍したチタン

電解チャージしたチタン(断面観察)

水素の拡散係数

④ まとめ



実験方法(拡散係数の決定) 断面観察用電解チャージ試料

チタン多結晶 (99.99 at%)

1.0 × 5 × 20 mm

真空焼鈍

800°C, 10^{-5} Pa

電解チャージ

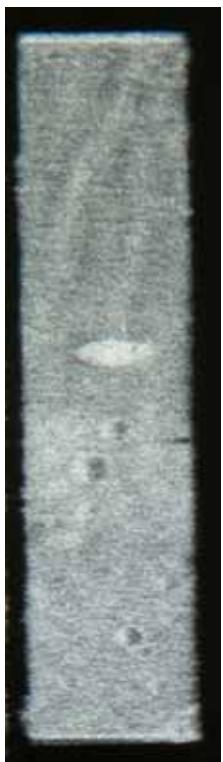
5 mA/mm², 31, 63, 98°C, 6, 18, 48h

断面観察のため整形

1.0 × 1.0 × 5 mm

実験結果 電解チャージした試料の断面

チャージ前

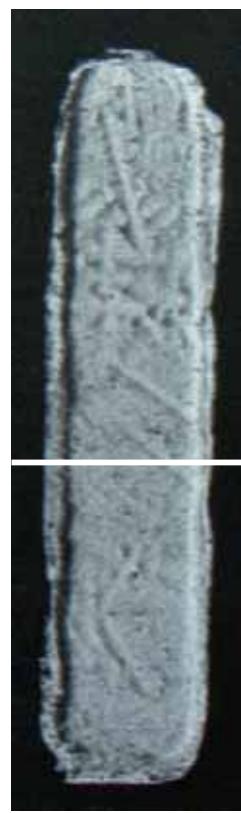


低角側

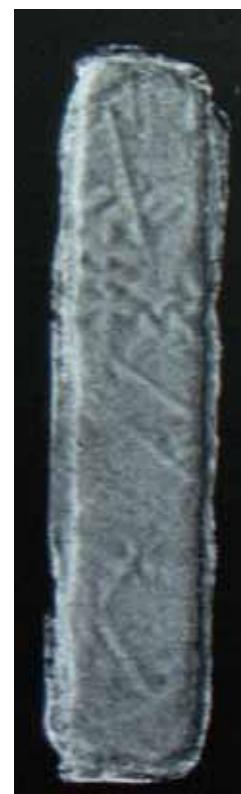


高角側

チャージ後 (98°C, 48h)



低角側

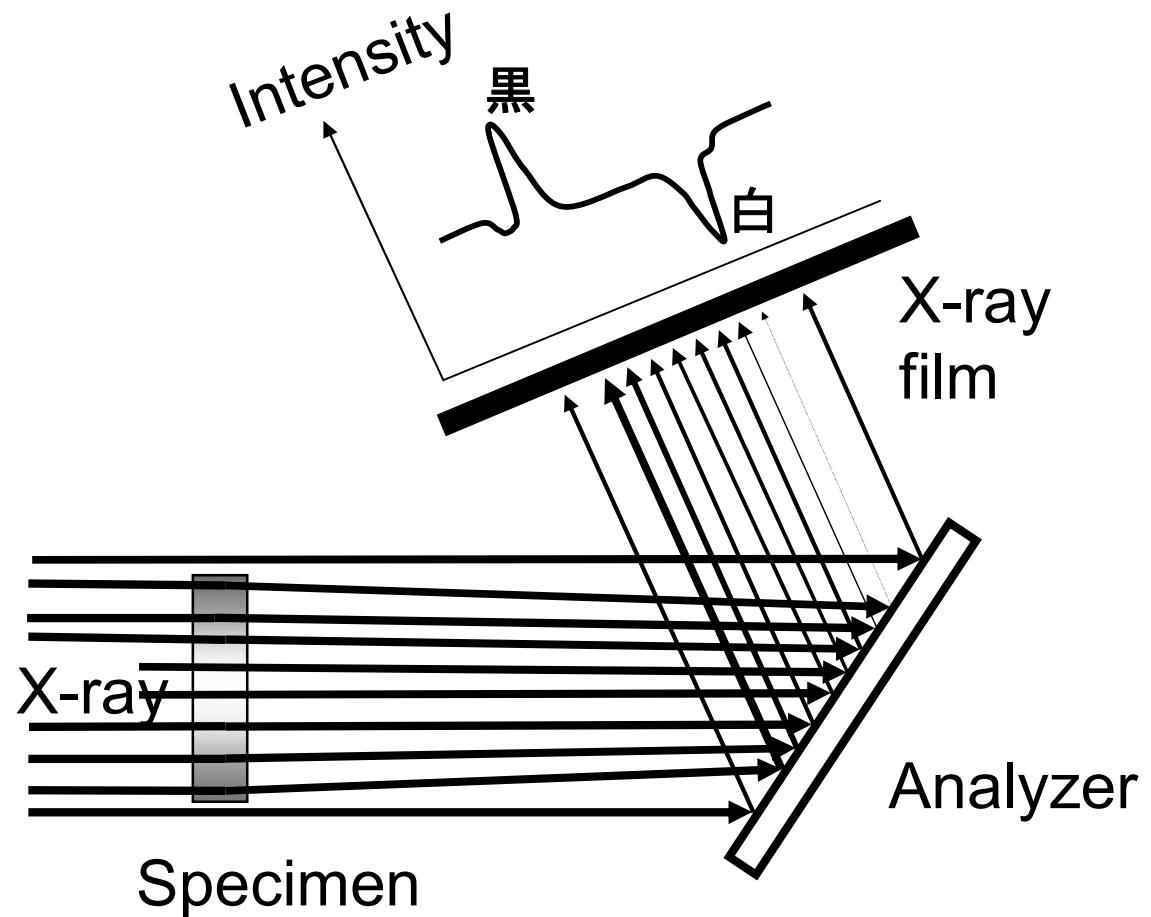


高角側

1mm

実験結果の解釈

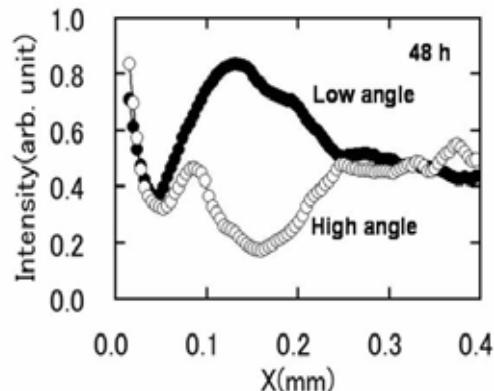
白黒コントラストの発生理由



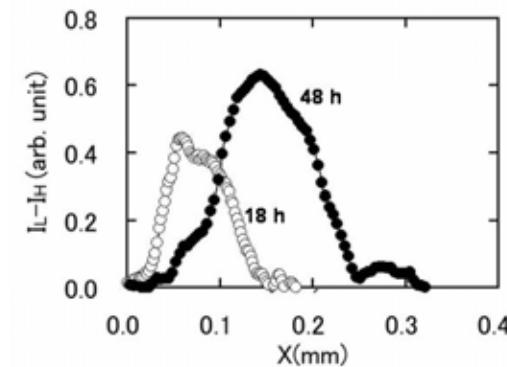
水素化物層のコントラストの解析

水素の拡散係数の決定

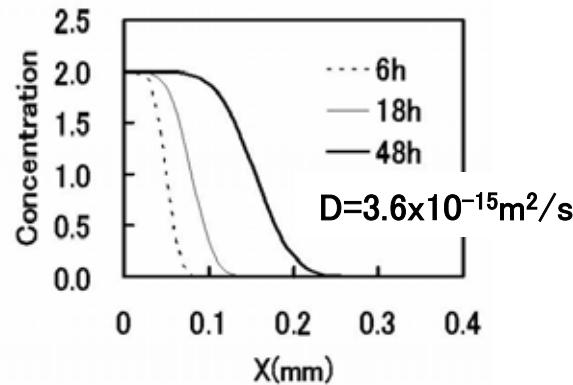
コントラストの測定



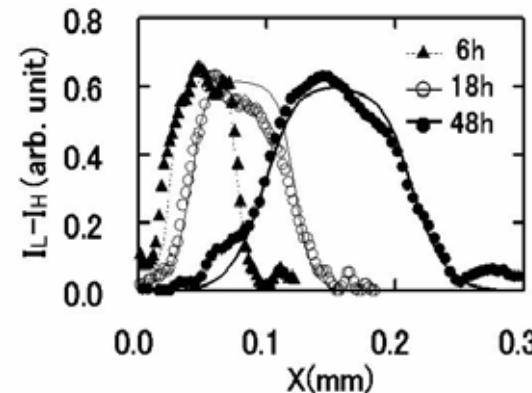
屈折コントラストの強度



水素の拡散

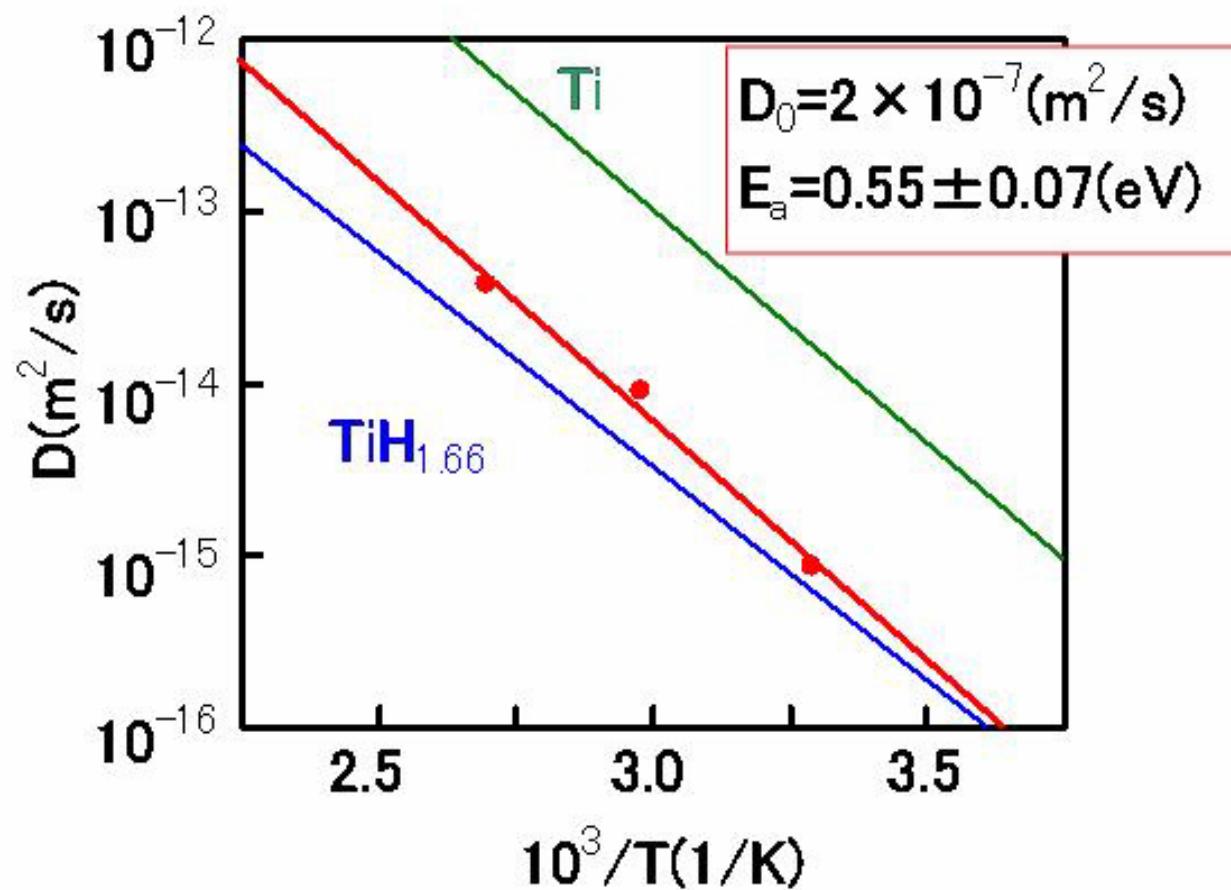


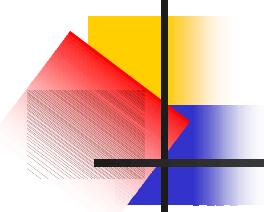
シミュレーションと実験結果の対応



結 果

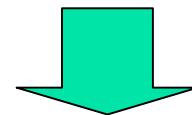
チタン水素化物中の水素の拡散係数





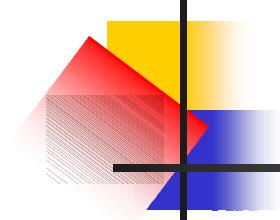
まとめ

- チタン中の水素化物
X線屈折コントラスト法(DEI法,
REI法)で観察可能
- 電解チャージ時間, 温度の差
水素化物の形成層の厚さの差



水素の拡散係数の決定

$$D(T) = 2 \times 10^{-7} \exp(0.55 \text{ eV}/kT) \text{ m}^2/\text{s}$$



謝 辞

金沢大学医学部

岡本博之

長崎大学教育学部

古谷吉男

新居浜工業高等専門学校

川崎宏一

SPring-8

梶原堅太郎

KEK-PF

平野馨一